# 「パワー半導体」評価サービス



- ■スイッチング特性評価
- ■静特性評価

- ■信頼性試験
- ■ノイズ試験

お客様の開発設計を促進するために、あらゆる角度から 「パワー半導体」に関する評価を支援いたします。



スイッチング評価設備



信頼性試験環境



ノイズ試験環境 電波暗室

■お問い合わせ先■

株式会社Wave Technology URL: https://www.wti.jp

本 社: 〒666-0024 兵庫県川西市久代3丁目13番21号

営業部: TEL 072-758-2938

メールでのお問い合わせ先:tech@wti.jp

Wave Technologyの ウェブサイト

WTI計

検索

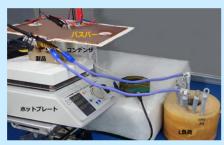
9-(1)



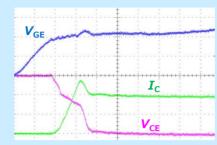


### ■スイッチング特性評価

- ・各種パワーデバイス、パワーモジュール製品(MOSFET、IGBT、SiCなど)
- ・1200 Vまでの製品に対応
- ・パワーモジュール(650 V 450 A) 評価実績あり
- ・正しいスイッチング波形及びパラメータの取得パートナー会社と連携した高精度シミュレーションモデルの作成に活用
- ・製品の内部インダクタンス評価
- ・スイッチングによる短絡耐量試験



スイッチング評価設備



パワーモジュールのターンオン波形例



製品と配線のインダクタンス評価

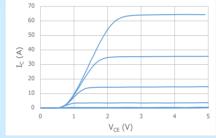
 $V_{\mathrm{GE(th)}}$  (V)

₩. - 15V

#### ■静特性評価

・2000 V 2000 Aまでの製品に対応(主要項目  $I_{\mathsf{CES}}$   $I_{\mathsf{GES}}$   $V_{\mathsf{GE(th)}}$   $V_{\mathsf{CE(sat)}}$   $V_{\mathsf{F}}$ 等)





	$V_{\text{GE}} = 1200 \text{ V}$	$V_{\rm GE}$ = $\pm~20$ V	$I_{\rm C}$ = 20mA	$I_{\rm C} = 400 {\rm A}$
1	0.92	22.8	5.91	1.41
2	0.83	23.4	5.90	1.40
3	1.04	23.3	5.85	1.41
4	0.83	23.0	5.91	1.42
5	0.76	23.9	5.90	1.41

 $I_{\mathsf{GES}}$  (nA)

Ices (uA)

静特性設備(カーブトレーサ)

V<sub>CF</sub>- I<sub>C</sub> 波形例

評価結果例

#### ■ 信頼性試験

- ・弊社及びパートナー会社にて各種信頼性試験を行うことができます。
- ・製品の構造解析、評価環境構築や治工具準備等の対応も可能です。



パワーサイクル試験環境



評価環境構築例



製品の構造解析例

## ■ノイズ試験

・弊社の電波試験環境(簡易電波暗室)で放射性ノイズや伝導ノイズ試験を行うことができます。

評価サービスの詳細内容は右側のURLをご覧ください。https://www.wti.jp/contents/keisoku-07.htm